

TUZ 2023

Call for Papers



Erfurt, 26. bis 28. Februar 2023

35. ITG / GMM / GI - Workshop Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen

Programmkomitee

J. Alt
Infineon Technologies AG
H. Amrouch
KIT
B. Becker
Universität Freiburg
A. Dalirsani
Bosch
R. Drechsler
Uni Bremen und DFKI
S. Eggersglüß,
Mentor, A Siemens Business
P. Engelke
Infineon Technologies AG
G. Fey
TU Hamburg
A.-P. Fonseca Müller
Bosch Sensortec GmbH
M. Gössel
Universität Potsdam
S. Hellebrand
Universität Paderborn
K. Hofmann
TU Darmstadt
S. Holst
Kyushu Institute of Technology
W. Hoppe
Rheinmetall AG
S. Huhn
Uni Bremen und DFKI
R. Krenz-Baath
Hochschule Hamm-Lippstadt
M. Krstic
Uni Potsdam und IHP GmbH
V. Petrovic
Brose
L. Bolzani Poehls
RWTH Aachen
I. Polian
Universität Stuttgart
S. Sattler
Uni Erlangen-Nürnberg
M. Sauer
Advantest Europe GmbH
M. Schillinsky
NXP Semiconductors Germany GmbH
H. Schmidt
IBM Deutschland GmbH
M. Schölzel
Hochschule Nordhausen
J. Sepulveda
Airbus Defence and Space
M. Tahoori
KIT
D. Tille
Infineon Technologies AG
M. Wahl
Universität Siegen
H.-J. Wunderlich
Universität Stuttgart

Der Workshop „Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen“ ist das bedeutendste deutschsprachige Forum, um Trends, Ergebnisse und aktuelle Probleme auf dem Gebiet des Tests, der Diagnose und der Zuverlässigkeit digitaler, analoger, Mixed-Signal- und HF-Schaltungen zu diskutieren. Der Austausch von Ideen ist ein wichtiges Anliegen des Workshops. Erwünscht sind sowohl Beiträge aus der industriellen Praxis als auch von Forschungseinrichtungen. Wir begrüßen stark praxisbezogene Erfahrungsberichte und Ergebnisse ebenso wie Beiträge zu theoretischen Themen unter anderem aus folgenden Bereichen:

- Adaptive Systeme (z.B. Selbstreparatur, self-healing, self-awareness)
- Automatisches Test-Equipment, Testautomatisierung, Testprogramme und Testmodellierung
- Defekt- und Fehlermodellierung
- Diagnose von Ausfallursachen
- Fehlertoleranz, Resilienz, Robuste und strahlenresistente Systeme
- Funktionale Sicherheit
- Hardware-orientierter Test und Hardware-orientierte Sicherheit
- Statistische und maschinelle Lernverfahren für Test und Zuverlässigkeit
- Systemtest und –zuverlässigkeit
- Test und Simulation von Mixed-Signal, HF- und Analog-Schaltungen
- Testerzeugung, Fehlersimulation, Selbsttest und Online-Test
- Testgerechter Entwurf, DFT Methodik
- Testkosten und Qualität
- Teststandards, z.B. IEEE 1149.x, IEEE 1687.x, IEEE P1838

Der Workshop findet im Victor's Residenz-Hotel in Erfurt statt und wird gemeinsam von den Hochschulen Nordhausen und Hamm-Lippstadt organisiert. Es ist geplant die Veranstaltung vollständig in Präsenz durchzuführen. Interessenten werden gebeten, die Zusammenfassung ihres Beitrags im Umfang von maximal 2 Seiten über die Workshop-Homepage einzureichen. Der Beitrag sollte den Zweck der Arbeit, den Neuigkeitsgehalt und Aspekte der Anwendung beschreiben. Angenommene Beiträge werden auf Wunsch in den informellen Workshop-Handout aufgenommen. Hierzu kann der Beitrag auf 4 Seiten erweitert werden.



Workshop-Homepage

www.tuz-workshop.de

Submission-Seite

<https://easychair.org/conferences/?conf=tuz23>

Wichtige Termine

Einreichung von Beiträgen: ~~06.11.22~~ **20.11.2022**

Benachrichtigung der Autoren: 18.12.2022

Camera-ready-paper: 18.01.2023

Tagungsleitung

Prof. Dr. Mario Schölzel

Hochschule Nordhausen

E-Mail: mschoelzel@hs-nordhausen.de

Programmkomitee-Vorsitzender

Prof. Dr. Rene Krenz

Hochschule Hamm-Lippstadt

E-Mail: Rene.Krenz-Baath@hshl.de

Veranstalter

GI FA 3.5 / GMM FA 6.5/ ITG FA 8.2 RSS Kooperationsgemeinschaft rechnergestützter Schaltungs- und Systementwurf



GMM

VDE ITG